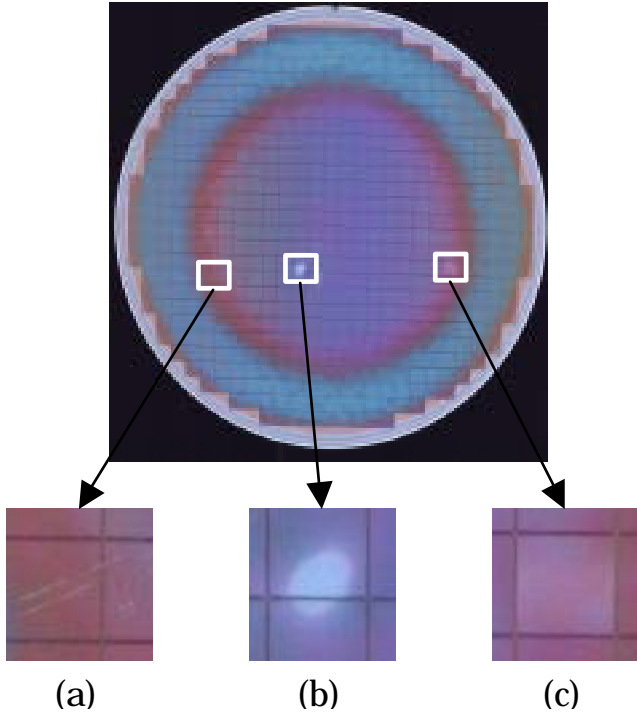
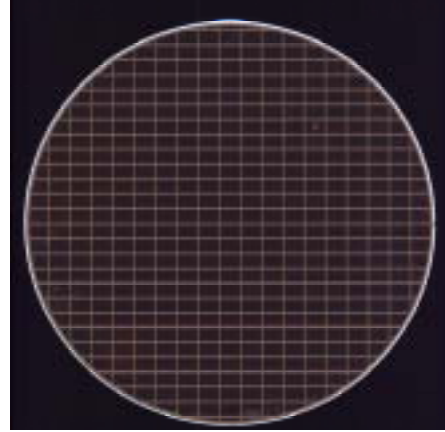


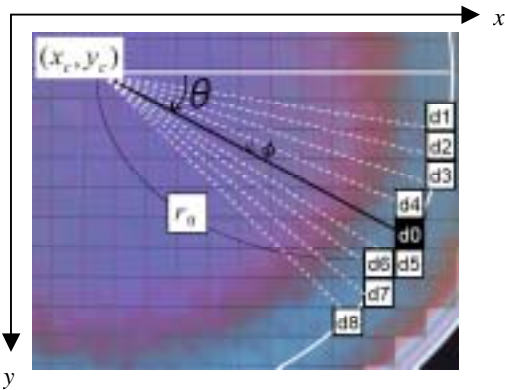
下地ムラに影響されないウェハマクロ欠陥検出アルゴリズム
下地ムラに影響されずにスクラッチ・デフォーカス・ホットスポット欠陥を自動検出する方法
(独)国立高等専門学校機構 熊本電波高専 / 小山善文・野崎康



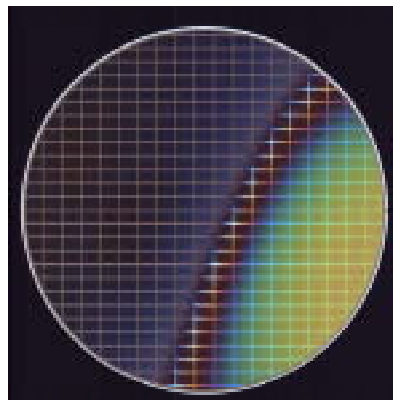
第 1 図 塗布ムラのあるウェハ画像 (タイプ 1)
(a) スクラッチ欠陥 (b) ホットスポット欠陥
(c) デフォーカス欠陥



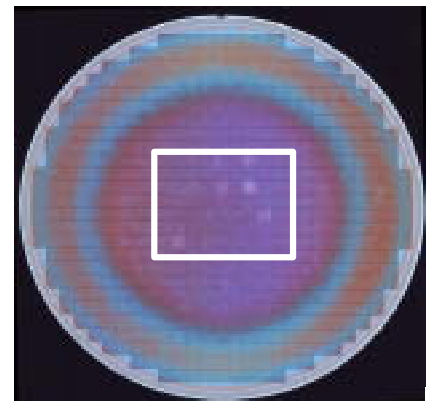
第 2 図 塗布ムラのないウェハ画像 (タイプ 2)



第 3 図 近傍ダイの設定



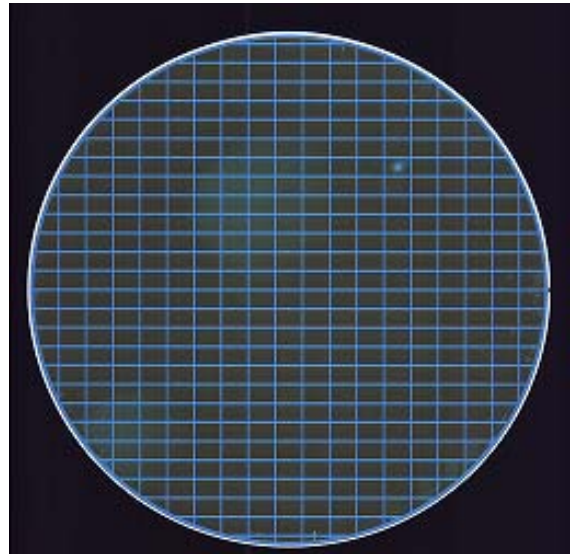
第 4 図 広範囲に広がる欠陥があるウェハ画像



第 5 図 サンプルウェハ画像 (タイプ 1)

1.00	1.00	0.98	1.08	0.96	1.24	0.97
1.00	1.01	0.98	0.98	0.87	0.93	0.90
1.01	0.99	0.97	1.20	0.91	1.59	0.93
1.00	1.00	1.00	1.00	0.97	0.97	0.90
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.97	1.23
0.97	0.97	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.27	0.97	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

第6図 図5中枠内ダイのP値



第7図 2度塗りウェハ画像